PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

LIVRE : RANDOM TESTING OF DIGITAL CIRCUITS

FICHE N° 9943

Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Informatique et Communication
Sous-domaines : Ordinateurs
Organisme : ACONIT
Ville : Grenoble (Isère)
Modèle :
Matériaux : Carton, Papier

Description

Titre traduit : Tests aléatoires de circuits intégrés
"Random testing of digital circuits" est un livre broché de 475 pages, daté de 1998, rédigé en anglais mais édité par le LAG, dont le titre traduit pourrait être "test de circuits digitaux selon des méthodes aléatoires"
Son auteur est René David, un enseignant/chercheur de l'IMAG de Grenoble. Il a travaillé dès les débuts au LAG, le Laboratoire d'Automatique de Grenoble, sous la direction de René Perret.
L'usage de la langue anglaise répond à l'objectif de diffusion au niveau international. Le fait que l'auteur soit français et grenoblois montre le rayonnement de Grenoble dans le domaine de l'informatique et des automatismes.
Le livre comprend de nombreux schémas et tableaux explicatifs des méthodes mises en œuvre.

Utilisation

Les méthodes aléatoires de test répondent à des problématiques de test portant sur des circuits digitaux qui deviennent de plus en plus complexes au fil du temps. Pour éviter que cette complexité croissante ne conduise à des temps de tests de plus en plus longs, la méthode aléatoire vise à s'assurer que chaque élément du circuit complexe soit testé au moins une fois, mais pas dans toutes les configurations possibles, ce qui permit de limiter au minimum les temps d'exécution des tests.